# CONCLUSIÓN

Como fue mencionado anteriormente, la constante evolución de los circuitos integrados y de los procesos litográficos, han permitido desarrollar dispositivos más potentes y eficientes, pero al mismo tiempo, los efectos producidos por los ASETs son más frecuentes, reduciendo así, la confiabilidad de los mismos.

Durante décadas se analizaron los SEEs sobre estructuras digitales dejando un vacio en el campo analógico. El presente análisis pretende contribuir al estudio de los ASETs aportando información sobre los efectos en conversores flash.